Zeitschrift: Vermessung, Photogrammetrie, Kulturtechnik : VPK = Mensuration, photogrammétrie, génie rural

Herausgeber: Schweizerischer Verein für Vermessung und Kulturtechnik (SVVK) = Société suisse des mensurations et améliorations foncières (SSMAF)

Band: 76 (1978)

Heft: 4

Rubrik: Berichte = Rapports

Autor: [s.n.]

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 09.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Vorträge für Ingenieur-Geometer-Kandidaten an der Schweizerischen Schule für Photogrammetrie-Operateure, St. Gallen

Im Rahmen des Photogrammetriekurses für Ingenieur-Geometer-Kandidaten werden an der SSPO folgende Vorträge gehalten:

Dienstag, 16. Mai 1978

9.45 *W. Altherr,* Kartograph, Zürich:
«Praktische Erfahrungen mit der Erstellung, Nachführung und Reproduktion des Übersichtsplanes»
W. Götsch, Kantonsgeometer, Solothurn, Präsident der Übersichtsplankommission:
«Zielsetzungen der Weisungen für die Vervielfältigung und Nachführung des Übersichtsplanes bei Grundbuchvermessungen»

14.00 *H. Diering,* Dipl. Ing. Vermessungsdirektion, Bern:
«Praktische Anwendungen der Photogrammetrie in der Grundbuchvermessung»

15.00 Diskussion über die Referate mit den Referenten

Mittwoch, 17. Mai 1978

9.00 *W. Bregenzer,* Dipl. Ing. ETH, Eidgenössischer Vermessungsdirektor:
«Die Organisation der schweizerischen Grundbuchvermessung»
P. Peitrequin, Kantonsgeometer, Lausanne, Präsident der Eidgenössischen Prüfungskommission für Ingenieur-Geometer:
«Das Prüfungswesen für Ingenieur-Geometer»

11.00 Diskussion über die Referate mit den Referenten und mit weiteren Mitgliedern der Eidg. Prüfungskommission sowie mit Professoren unserer beiden Technischen Hochschulen

14.00 Fortsetzung der Diskussion

Zulassung: Wegen knapper Raumverhältnisse ist die Anzahl der Teilnehmer beschränkt; die Zulassung erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen.

Anmeldung: Schriftlich oder telephonisch beim Sekretariat der Schweizerischen Schule für Photogrammetrie-Operateure, Rosenbergstrasse 16, 9000 St. Gallen, Telephon (071) 23 23 63.
Anmeldegebühr: Fr. 100.–

Berichte Rapports

Festkolloquium an der Technischen Universität Wien zum 80. Geburtstag von Prof. Dr. h. c. Karl Neumaier

«Ein langjähriger guter und treuer Freund der Schweiz», das ist der Tenor der Grussadresse von Dr. h. c. Hans Härry in der Festschrift zu Karl Neumaiers 80. Geburtstag.

Die Festschrift*, die dem Jubilar am Vortag seines Geburtstages bei einem Festkolloquium überreicht wurde, ist eine Veröffentlichung des Institutes für Photogrammetrie; Herausgeber ist der neue Institutsvorstand Prof. Dr. K. Kraus, der Nachfolger Prof. Neumaiers.

Prof. Kraus hat es sehr geschickt verstanden, den Umfang der Festschrift auf ein lesenswertes Mass zu beschränken; in einem Dutzend Beiträgen kommen – mit Ausnahme der Grussadresse – nur ehemalige Schüler und Mitarbeiter des Jubilars zu Wort. Zunächst würdigt sein engster Mitarbeiter und Nachfolger in der Leitung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, Präsident F. Eidherr, sehr ausführlich den beruflichen Werdegang und Wirkungsbereich des Jubilars. Hier nur einige knappe Hinweise: Staatsprüfung als Geometer 1925, Vermessungspraxis und Hochschulassistent bis 1929; dann bis 1938 vielseitige Tätigkeit vom Berater bis zum Universitätsprofessor in China; 1938–1940 wissenschaftlicher Mitarbeiter Prof. Schermerhorns in Delft; 1941–1945 Leitung des photogrammetrischen Institutes der Südosteuropagesellschaft in Wien. Ab 1945 Leiter der «Landesaufnahme und Photogrammetrie» im Bundesvermessungsamt, 1960 dessen Präsident. Ehrendoktor der T. H. Graz. Ab 1964 Professor für Photogrammetrie an der T. U. Wien. 1966 bis 1975 Präsident des Schulrates der SSPO.

Über die vielen Verdienste Neumaiers in dieser Zeitschrift zu schreiben, ist wohl kaum nötig. Wie Dr. Härry in der Grussadresse in launiger Weise schildert, lassen sogar die korrekten Grenzbeamten der Schweiz «den bekannten Professor Neumaier aus Wien» ohne Pass einreisen. Die Wertschätzung des Jubilars ist also bekannt und grenzenlos.

Die wissenschaftlichen Beiträge der Festschrift sind ausnahmslos lesenswert und runden das Bild der Ausstrahlung Neumaiers ab. Eine wertvolle Ergänzung zum Lebensbild bietet der ausführliche Beitrag von *J. Bernhard* über die Entwicklung der Photogrammetrie im

* Erschien als Heft 13 der «Geowissenschaftlichen Mitteilungen» der Studienrichtung Vermessungswesen, Technische Universität Wien. DIN A4, 245 S.; A-1040 Wien, Gusshausstrasse 27–29.

Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen seit 1945. Berichte über ausgeführte Arbeiten im Ausland bringen *O. Kölbl* über Waldkartierungen in der Schweiz und *J. Fischer* zur Erstellung einer Karte 1:25 000 im Süden Venezuelas. *P. Waldhäusl* bespricht den «Versuch Wien» der OEEPE/C. *G. Otepka* und *E. Duschanek* untersuchen erste praktische Orthophotoarbeiten aus der neuesten Entwicklungsreihe. *H. Schneider* schildert die Zukunftsphotogrammetrie mit analytischen Auswertegeräten. *F. Leberl* holt noch weiter aus und spricht über Satellitenphotos und Fernerkundung. *D. J. Bakker* und *K. Kubik* behandeln die Möglichkeiten der Seebodenkartierung mit Side Looking Sonar. Weiter sei der einzige theoretische Beitrag hervorgehoben: *H. Ebner* beschreibt eine a-posteriori-Gewichtsschätzung bei verallgemeinerter Ausgleichung und bespricht die Anwendung in Blöcken mit Selbstkalibrierung. Last but not least seien noch *H. G. Jeries* Betrachtungen über Kosten- und Leistungsmodelle für Planungs- und Entscheidungsaufgaben genannt. Er behandelt die Problemanalyse und die notwendigen Forschungsprogramme zur Optimierung des Zusammenspiels der Einflussfaktoren im Produktionsprozess als Entscheidungshilfe. Ein sonst zu wenig beachtetes Thema!

Zum Festkolloquium versammelten sich einige hundert Freunde und Fachkollegen Prof. Neumaiers aus ganz Österreich, darunter recht viele aus dem Ausland. Eine freundliche Begrüssung durch den Rektor und herzliche Würdigungsworte seitens des Dekans, Prof. Hans Schmid, leiteten zum Festvortrag von Präsident Eidherr über, dessen sachlichen Teil man in der Festschrift zwar nachlesen kann, aber die Würze mit Anekdoten und Bonmots, die der Vortragende aus dem Erlebnis jahrelanger Zusammenarbeit in seinen Vortrag einflechten konnte, müsste man in der Festschrift zwischen den Zeilen lesen.

Nach dieser Laudatio überreichte Prof. Kraus Festschrift und Blumen.

Beim nachfolgenden Empfang wurden dem Jubilar natürlich auch seitens der Schweiz die herzlichsten Wünsche überbracht. *H. Kasper*

Firmenberichte
Nouvelles de firmes

Antistatic-Pistole ASP 21

ZEROSTAT ASP 21 ist ein Handgerät zur Elimination elektrostatischer Aufladungen von Oberflächen in industriellen und anderen Betrieben. Elektrostatische Aufladung entsteht auf isolierenden Oberflächen durch Reibung mit andern, verschiedenartigen Oberflächen. Die Auswirkungen sind folgende: Verschmutzung durch Anziehung von Staub und Interferenz zwischen der aufgeladenen Oberfläche und umliegenden Gegenständen.

Die herkömmlichen Methoden zur Entfernung des Staubes von Oberflächen basieren auf Lappen, Tüchern und verschiedenen Arten von Bürsten. Durch die Reibung entsteht eine höhere elektrostatische Aufladung, die ihrerseits eine unvollständige Entfernung der Staubpartikel und eine verstärkte Anziehungskraft der Oberfläche bewirkt. Während die Verwendung von antistatischen Flüssigkeiten und Cremen einen gewissen Schutz erzielen kann, sind die verbleibenden Überreste unangenehm und die erzielten Ergebnisse je nach klimatischen Bedingungen unterschiedlich.

Die einzig wirksame Methode zur Bekämpfung der elektrostatischen Aufladung besteht darin, die Oberflächenaufladung durch einen elektrostatischen Prozess zu neutralisieren, bei dem Ionen der entgegengesetzten Polarität erzeugt werden, wodurch die Aufladung aufgehoben wird. Genau dies ist die Wirkungsweise von ZEROSTAT ASP 21.

Beschreibung

Der ZEROSTAT-Antistatic-Pistole wurde in Zusammenarbeit mit einer führenden britischen Universität entwickelt. Sie vereinigt in sich die letzten Erkenntnisse auf dem Gebiet der elektrostatischen Wissenschaft. Die ASP 21 enthält eine piezoelektrische Zelle von hoher Leistungsfähigkeit. Diese Kapsel wird auf mechanische Weise belastet durch Drücken auf den Betätigungshebel (Abzug) der Pistole. Diese mechanische Belastung erzeugt eine hohe Voltspannung, etwa 10 kV, die auf eine in der Mitte des Laufes festgemachte Corona-Entlade-Nadel übertragen wird. Die hohe Feldstärke an der Spitze der Nadel wirkt sich auf die umliegende Luft aus, die Spitze wird ionisiert. Die Ionen stossen sich gegenseitig von der Nadelspitze ab, so dass durch Drücken auf den Abzug im Lauf ein ionisierter Luftstrom erzeugt wird. Wird auf den Abzug gedrückt, werden positive Ionen abgegeben, wird der Abzug losgelassen, werden negative Ionen frei.

Bedienung

Die Antistatic-Pistole ASP 21 wird in etwa 25 bis 50 cm Entfernung auf die zu entladende Oberfläche gerichtet. Der Abzug wird während 5 Sekunden langsam durchgedrückt, nach einer Pause von 2 Sekunden wird der Abzug losgelassen. Bei grossen oder stark aufgeladenen Oberflächen sind unter Umständen mehrere Anwendungen bis zur vollständigen Neutralisation notwendig.

In der ersten Phase der Anwendung werden positive Ionen erzeugt, die von allen negativ geladenen Oberflächen in der Nähe angezogen werden. Wenn diese Ionen in Berührung mit der zu behandelnden Oberfläche kommen, setzt die Aufhebung der Ladung ein, bis diese vollständig neutralisiert ist. In der Folge zieht die Oberfläche keine weiteren Ionen mehr an, so dass auch keine weitere Aufladung der Oberfläche im Laufe der Behandlung erfolgen kann. Die Pause zwischen dem Drücken und dem Loslassen des Abzugs dient dazu, den positiven Ionen genügend Zeit zu lassen, sich zu verteilen, bevor durch Loslassen des Abzugs die negativen Ionen erzeugt werden. Auf die gleiche Weise bewirken die negativen Ionen die Neutralisierung positiv geladener Oberflächen. Bei jedem Arbeitsvorgang werden mindestens 3 Mikro-Asec positiver und negativer Ladung erzeugt.